

# 薄膜測厚儀(N&K)



**設備負責人：**陳信助助理教授 TEL：07-5252000#6612

Mail：chenhc@mail.nsysu.edu.tw

王俊明教授 TEL：07-5252000#6616

Mail：albert.wang@g-mail.nsysu.edu.tw

林明德教授 TEL：07-5252000#6617

Mail：mingtelin@mail.nsysu.edu.tw

**設備管理人：**紀佳伶小姐 TEL：07-5252000#6636

Mail：jlji26@mail.nsysu.edu.tw

## 儀器資訊：

1. 廠牌型號：新元鋒精密 (Film Sense FS-RT300)
2. 購置年限：115年2月
3. 放置地點：電資大樓地下室 EC0006(量測分析實驗室)
4. 功能：量測透明薄膜厚度
5. 規格：
  - I. 量測試片尺寸：破片~12吋晶圓
  - II. 橢圓偏振數據：波長涵蓋 370 - 950 nm 的光譜範圍。
  - III. 透明薄膜量測厚度：1 至 5000 nm
  - IV. 測量光束尺寸：1 mm x 2 mm

## 自行操作：

經具有設備自行操作資格人員訓練後且通過考核方取得自行操作資格。

(詳請參閱：本網頁規章表單>設備操作辦法>自行操作資格取得辦法)

通過考核後，可至「國立中山大學半導體聯合實驗室」進行預約及自行操作設備。

## 委託操作：

請至「國立中山大學半導體聯合實驗室」預約，再於本網頁下載委託操作申請表，將申請表填寫好後送至半導體聯合實驗室由管理人員進行委託代工服務。

收費資訊：

收費標準(單位：元/分)	自行操作	委託操作
學術單位	10	20
業界單位	50	70